

透過電子顕微鏡の基礎と 試料前処理方法のご紹介

日 時 2025年2月4日(火) 14:00~15:30

開催方法 オンライン(ZOOM) 定員 300名

講 師 青木 遥 氏

日本電子株式会社

EM事業ユニット EMアプリケーション部 2G

透過電子顕微鏡(TEM)は、試料の内部構造をナノスケールで観察することができるため、生物・高分子系から金属系まで幅広く用いられています。しかし、観察試料に応じた適切な前処理を行わないと試料本来の姿を観察することはできません。本セミナーでは、TEMの基礎的な原理と装置の構成について解説するとともに、TEM用試料の前処理方法についてご紹介いたします。

問い合わせ

オンライン研修実行委員会

denkengijutsu2024_online@googlegroups.com

申込締切

1月30日



主催 電子顕微鏡技術情報交流会

マテリアル先端リサーチインフラ

共催 日本電子株式会社、大学連携研究設備ネットワーク

大学高専等の教育機関に所属する
方のみ、ご参加いただけます